

走査型電子顕微鏡（日本電子JSM-6510）

半導体，新素材など幅広い機械・機能材料分野での観察と分析にも用いられる。破面観察による破壊原因の調査，異物の分析，研究開発など応用範囲の広い装置

【型式】

日本電子（株） JSM-6510A

【仕様】

分解能 3nm，加速電圧～30kV，最大試料サイズ 150mmΦ，分析可能元素 Be～U，
エネルギー分解能 129eV

【設置年度】

2010 年度（平成 22 年度）



※ 平成 22 年度（公財）JKA 補助事業対象機器

○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日